(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-283104

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl. ⁶	觀別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇別	斤
H01L 21/027							
B05C 11/08							
G03F 7/16	502						
			H01L	21/ 30	564	C	
			審査請求	未替求	韶求項の数2	OL (全 6 頁))
(21)出顧番号	特顯平6-68415		(71)出題人	5910365	505		
				変電セ	ミコンダクタシブ	くテムエンジニアリ)
(22)出顧日	平成6年(1994)4	1	ング株	式会社			
				兵庫県	尹丹市瑞原4丁目	11番地	
			(71)出顧人				
					数株式会社		
			1		千代田区丸の内ニ	二丁目2番3号	
			(72)発明者				_
						1 菱電セミコンタ	
						アリング株式会社内	Ā
			(72)発明者		- -		
						8 菱電セミコンタ	
						アリング株式会社内	3
			(74)代理人	弁理士	帝田 守		
							

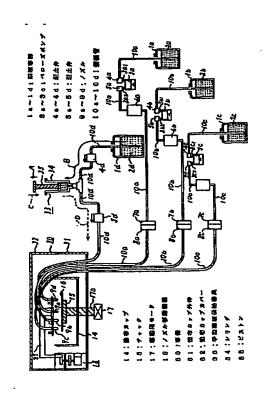
(54) 【発明の名称】 薬液塗布装置

(57)【要約】

【目的】 半導体ウエハ上に自動で薬液塗布する時と同 に環境等の条件でもって手動での薬液塗布を可能とす る。

【構成】 手動薬液供給手段でもって薬液容器から薬液を吸入し、ノズルへ供給すると共に所定の温度、湿度に制御された塗布カップ内で回転する半導体ウエハの中心部にノズル移動機構により上記ノズルを移動するようにしたものである。

【効果】 薬液の正確な評価を容易に行うことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 温度、湿度が一定に制御された塗布カッ プ内に配設されたチャックに固定され上記チャックと共 に回転駆動される半導体ウエハに薬液を滴下する第1の ノズルを上記半導体ウエハのほぼ中心部に移動するノズ ル移動機構と、上記薬液を第1の薬液容器から吸入し上 記ノズルに供給する自動薬液供給手段とを備えた薬液塗 布装置において、上記半導体ウエハに薬液を滴下する第 2のノズルと、上記第2のノズルに供給される薬液が収 納された第2の薬液容器と、上記第2のノズルに接続さ 10 プ3 a と逆止弁5とを介し接続管 10 a によって薬液容 れ上記第2の薬液容器から薬液を吸入し上記第2のノズ ルに供給する手動薬液供給手段とを設け、上記第2のノ ズルを上記ノズル移動機構により上記半導体ウエハのほ ば中心部に移動するようにしたことを特徴とする薬液塗 布装置。

【請求項2】 温度、湿度が一定に制御された塗布カッ プ内に配設されたチャックに固定され上記チャックと共 に回転駆動される半導体ウエハに薬液を滴下する第1の ノズルを上記半導体ウエハのほぼ中心部に移動するノズ ル移動機構と、上記薬液を第1の薬液容器から吸入し上 20 記ノズルに供給する自動薬液供給手段とを備えた薬液塗 布装置において、上記ノズル移動機構により上記半導体 ウエハのほぼ中心部に移動され上記半導体ウエハに薬液 を滴下する第2のノズルと、上記第2のノズルに供給さ れる薬液が収納された第2の薬液容器に接続された第1 の弁と、上記第2のノズルに接続された第2の弁と、上 記第1と第2の弁に連通するシリンダと、上記シリンダ 内を手動により往復動し上記シリンダ内を陰圧または陽 圧にするピストンで構成された手動薬液供給器具とを設 け、上記陰圧時に上記第1の弁を開き、上記陽圧時に上 30 記第2の弁を開くようにしたことを特徴とする薬液塗布 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は半導体ウエハにレジス ト等の薬液を塗布する薬液塗布装置に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】図2は従来の薬液塗布装置を示す構成図 であり、図において、1a、1b、1cはそれぞれ異な 40 るレジスト等の薬液2a、2b、2cが収納された薬液 容器、3a、3b、3cはポンプ駆動装置(図示せず) により駆動制御されるベローズポンプ、4a、4b、4 cはベローズポンプ3a、3b、3cの吸入口3a1、 3b1、3c1にそれぞれ接続された逆止弁、5a、5 b、5 cはベローズポンプ3 a、3 b、3 cの吐出口3 a2、3b2、3c2にそれぞれ接続された逆止弁、6 a、6b、6cはベローズポンプ3a、3b、3cから 吐出された薬液2内に含まれる異物を除去するフィル 9、7a、7b、7cは空気式バルブ (AIROPER 50 について説明する。エアシリンダ 27によってアーム 2

ATED VALVE)、8a、8b、8cはサックバ ックバルブ、9a、9b、9cは後述の塗布カップ14 内に配設されたノズルであり、図5に示されるように基 板11と、上記基板11に固定されテフロンチューブ等 の接続管10に接続されるノズル本体12と、切り込み 部13aを有し基板11に固定された係合子13とによ り構成されている。

2

【0003】ノズル9aはサックバルブ8aと空気式バ ルブ7aとフィルタ6aと逆止弁10aとベローズポン 器1aに接続され、空気式バルブ7aによってノズル9 aからの薬液2の滴下量が制御され、かつ、ノズル9a から所定量の薬液2aが滴下された後、ノズル9aから 薬液2aが垂れ下がらないようにサックバックバルブ8 aによって薬液2が吸引される。また、ノズル9b、9 cも同様にサックバックバルブ8b、8cと空気式バル ブフb、7cとフィルタ6b、6cと逆止弁5b、5c とベローズポンプ3b、3cおよび逆止弁4b、4cを 介し接続管10b、10cによって薬液容器1b、1c に接続される。30は塗布カップ外枠31と塗布カップ カバー32とで構成される容器、14は容器30内に配 設された塗布カップで、塗布カップ14内は温湿度制御 装置 (図示せず) によって所定の温度、湿度に制御され ている.

【0004】15は塗布カップ14内に配設されモータ 軸17aを介し駆動用モータ17によって回転駆動され るチャック、16はチャック15に固定され駆動用モー タ17によってチャック15と共に回転駆動される半導 体ウエハ、18は容器11内に配設されノズル9a、9 b、9cの内の何れかを選択しアーム25によって半導 体ウエハ16の中心部に移動するノズル移動装置であ り、図3に示されるように、容器11内に固着されるケ ース19と、ケース19内に固着されたステッピングモ ータ等からなる駆動用モータ20と、ケース19の内面 にX軸方向に延在するように配設されたレール21と、 エンドレスベルト22a、22bと、プーリ23a、2 3 bとからなる動力伝達機構24と、動力伝達機構24 を介し駆動用モータ20によって駆動されレール21上 を摺動しX軸方向に移動するアーム25とで構成されて

【0005】また、アーム25はアーム本体26とアー ム本体26を上下方向に駆動するエアーシリンダ27 と、図4に示されるように枢軸27を支点として回動 し、アーム本体26の先端部に形成された凹部26aに 挿入されたノズル9の係合子13の切り込み部13aと 係合するレバー28と、レバー28を駆動するエアシリ ンダ29とによって構成されている。

【0006】次に動作について説明する。先ず、半導体 ウエハ16に薬液ビン1a内の薬液2aを塗布する場合

5を上昇させ、駆動モータ20をそのモータ軸が時計方 向に回転するように駆動するとベルト22bも時計方向 に回転しアーム25がx軸に沿ってレール21上を図3 において右方向に移動し、アーム25の凹部26aがノ ズル9 aの係合子13上にくると駆動モータ20は停止 する。そして、アーム25はエアシリンダ27によって 駆動され下降し、図4に示されるように凹部26a内に ノズル9aの係合子13が挿入される。 ノズル9aの係 合子13が凹部26内に挿入されるとエアシリンダ29 によりレバー28が枢軸27を中心として半時計方向に 10 たな薬液をつなぎ込むには多くの時間が必要である。こ 駆動され、レバー28の先端部が係合子13の切り込み 部13a内に入り込み係合子13にレバー28が係合し ノズル9 aはアーム25に保持される。

【0007】アーム25にノズル9aが保持されるとア ーム25はエアシリンダ27によって再び駆動され上昇・ する。そして、動力伝達機構24を介し駆動用モータ2 0により駆動されアーム25がx軸に沿ってレール21 上を図3において左方向に移動し、ノズル9aが半導体 ウエハ16の中心部にくると駆動用モータ20は停止す る。半導体ウエハ16の中心部にノズル9aがくるとア 20 ーム25はエアシリンダ27により駆動され半導体ウエ ハ16とノズル9aとの間隔が所定の間隔になるまで下 降する。 ノズル9 aが半導体ウエハ16の中心部上の上 記所定間隔位置に位置決めされると、チャック15に固 定された半導体ウエハ16はチャック15と共に駆動用 モータ17によって所定回転数で回転駆動される。そし て、ベローズポンプ3aはポンプ駆動装置(図示せず) によって駆動され、薬液ピン1a内の薬液2aが逆止弁 4 a、5 aとフイルタ6 aと空気式バルブ7 aおよびサ ックバックバルブ8aを介してノズル9aに供給され、 ノズル9 aから所定量の薬液2aが半導体ウエハ16上 に滴下される。半導体ウエハ16上に滴下された薬液2 aは半導体ウエハ16が駆動用モータ17により所定の 回転数で回転しているので、その遠心力により半導体ウ エハ16の周辺に広がり、半導体ウエハ16上に膜が形 成される。これにより半導体ウエハ16上への薬液2a の塗布は完了する。

【0008】次に、半導体ウエハ16に薬液ピン16内 の薬液2 bを塗布する場合について説明する。アーム2 5をX軸に沿って図3において右方向に移動したとき、 アーム25の凹部26 aがノズル9 bの係合子13上に くるように、ノズル9bをノズル駆動装置(図示せず) によりY軸方向に移動する。そして、前述と同様に、ノ ズル移動装置18によってノズル9bが選択され半導体 ウエハ16の中心部に移動されると、ペローズポンプ3 bおよび駆動用モータ17が駆動され、所定回転数で回 転している半導体ウエハ16上に薬液2bが滴下され、 半導体ウエハ16上に薬液2bの膜が形成される。これ により半導体ウエハ16上への薬液2bの塗布は完了す る。なお、半導体ウエハ16に薬液ビン1c内の薬液2 50 ためになされたもので、半導体ウエハに薬液を自動的に

cを塗布する場合も上述と同様に行われるので、その説 明を省略する。

【0009】次に、半導体ウエハに薬液を自動的に塗布 する上記薬液塗布装置に新たな薬液をつなぎ込む場合に ついて説明する。この場合、先ず、その薬液の評価が行 われるが、この評価用の薬液ビンにはサンプルの薬液が 少量 (約200ml~500ml) しか入っておらず、 一方、上記薬液塗布装置に新たな薬液をつなぎ込むには 薬液を多量(約1~2リットル)に必要とし、また、新 のため、上記薬液塗布装置に評価用の薬液ビンをつなぎ 込む段階で薬液がなくなってしまい評価が行えない。よ って、薬液の評価を行うために、図6に示されるよう に、薬液吸入吐出口34aを有するシリンダ34とシリ ンダ34内を手動により往復運動するピストン35とで 構成される注射器型の手動薬液供給器具33を用いる。 【0010】次に動作について説明する。まず、薬液吸 入口34 a を上記評価用の薬液ビン (図示せず) 中に挿 入しピストン35を手で引きシリンダ34内を陰圧にす ると、上記薬液容器中のサンプルの評価用薬液2 dがシ リンダ34内に吸入される。 次いで、 塗布カップカバー 32を開放する。この状態においてチャック15は駆動 用モータ17により回転駆動され、チャック15に固定 されている半導体ウエハ16がチャック15と共に所定 の回転数で回転駆動される。次いで、シリンダ34内に 評価用薬液2dが吸入された手動薬液供給器具33を手 で移動し半導体ウエハ16の中心部をねらってピストン 35を手で押しシリンダ34内を陽圧にすると、シリン ダ34内の薬液2dが半導体ウエハ16上に滴下する。 滴下した薬液2aは半導体ウエハ16が回転しているの で、その遠心力により半導体ウエハ16の周辺に広が り、半導体ウエハ16の上面に広がり半導体ウエハ16 上に膜が形成される。これにより薬液の塗布は完了す る.

[0011]

【発明が解決しようとする課題】従来の薬液塗布装置は 以上のように構成されているので、半導体ウエハへの手 動による薬液塗布時に塗布カップカバーを開放しなけれ ばならず、そのために塗布カップ内の温度、湿度を一定 に制御することができず、かつ、手動薬液供給器具を手 持ちで半導体ウエハ上に移動し薬液を滴下するため、薬 液を半導体ウエハの中心部に上手く滴下することができ ず、手ぶれにより、毎回、塗布条件が異なる。そのため 半導体ウエハ表面の塗布膜厚の均一性が悪くなり、上記 薬液塗布装置で自動的に薬液を塗布した場合と膜厚均一 性が異なり正確な評価ができない。また、手動薬液供給 器具の吸入できる薬液吸入量は少ないので、一度に多数 の半導体ウエハを処理できない等の問題点があった。

【0012】この発明は上記のような問題点を解消する

薬液塗布する場合と同様に塗布カップカバーを閉じた状態で、かつ、薬液を半導体ウエハの中心部に手動にて滴下することができ、連続塗布処理も可能な薬液塗布装置を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】この発明にかかる薬液塗布装置は薬液手動供給手段を半導体ウエハに薬液を滴下するノズルと薬液容器とに接続し、上記ノズルをノズル移動機構により上記半導体ウエハの中心部に移動するようにしたものである。

【0014】また、シリンダと、上記シリンダ内を手動により往復運動し上記シリンダ内を陰圧または陽圧にするピストンとで構成された手動薬液供給手段の上記シリンダを第1の弁を介し薬液容器に、第2の弁を介してノズルに接続し、上記陰圧時に上記第1の弁を、陽圧時に上記第2の弁をそれぞれ開くようにすると共に上記ノズルをノズル移動機構により半導体ウエハの中心部に移動するようにしたものである。

[0015]

【作用】この発明における薬液塗布装置は所定の温度、 湿度に制御された塗布カップ内で、所定の回転数で回転 する半導体ウエハの中心部へ、ノズル移動手段によって 移動されたノズルに手動薬液供給手段により薬液が供給 され、上記ノズルから上記半導体ウエハの中心部に滴下 され、遠心力によって上記半導体ウエハ上に上記薬液の 膜が形成される。

【0016】また、手動薬液供給手段により第1の弁を 介し薬液容器から薬液の吸入時は上記手動薬液供給手段 とノズル間に挿入された第2の弁は閉じ、上記吸入した 薬液の上記ノズルへの供給時は上記第1の弁は閉じられ 30 る。

[0017]

【実施例】

実施例1. 図1はこの発明の実施例1による薬液塗布装 置を示す構成図であり、図1において、図2と異なると ころは、図5に示されるように基板11と、上記基板1 1に固定されノズル本体12と、切り込み部13aを有 し基板 11に固定された係合子13とにより構成された ノズル9dを、ノズル9a、9b、9cと同様にノズル 駆動装置 (図示せず) により図3においてY軸方向に駆 動され、アーム25によりX軸方向に移動されるように ノズル9a、9b、9cと並べて配設すると共に、薬液 吸入吐出口34aを有するシリンダ34とシリンダ34 内を手動により往復運動するピストン35とで構成さ れ、容器30の近傍に配設された注射器型の手動薬液供 給器具33を、逆止弁4dを介してテフロンチュウブ等 の接続管10dにより評価用薬液2dが収納された薬液 容器1dに接続し、逆止弁5dを介して接続管10dに よりノズル9dに接続した点である. なお、 上記シリン ダ34は透明材で形成され、薬液の吸入量および吐出量 50

が制御できるように、その表面にはメモリ(図示せず) が付されている。

【0018】次に動作について説明する。薬液2a、2 b、2cの塗布については前述と同様であるので、その 説明を省略し、評価用薬液2dの塗布について説明す る。 先ず、 アーム 25 が X軸に沿って図3 において右方 向に移動したとき、アーム25の凹部26 aがノズル9 bの係合子13上にくるように、ノズル9bはノズル駆 動装置 (図示せず) によりY軸方向に駆動される。 そし て、ノズル移動装置18によって前述と同様にしてノズ 10 ル9 dが選択され、温湿度制御装置 (図示せず) によっ て所定の温度、湿度に制御されている塗布カップ14内 の半導体ウエハ16の中心部に移動される。 次いで、 手 動薬液供給器具33のピストン35を矢印A方向に手で 引きシリンダ34内を陰圧にすると、逆止弁4dが開い て薬液容器1dから評価用薬液2dが逆止弁4dを介し 矢印B方向に流れシリンダ34内に吸入される。この 時、逆止弁5 dは閉じているのでノズル9 dからの薬液 の逆流はない。次いで、ピストン35を手で矢印C方向 に押しシリンダ34内を陽圧にすると、逆止弁4dは閉 20 じ、逆止弁5 dが開いてシリンダ34内の評価用薬液2 dが矢印D方向に流れ逆止弁5dを介してノズル9dに 供給され、半導体ウエハ16の中心部上に滴下する。半 導体ウエハ16は駆動用モータ17によってチャック1 5と共に所定回転数で回転しているので、その遠心力に よって、上記滴下した評価用薬液2dが半導体ウエハ1 6上の周辺に広がり、半導体ウエハ16の上面に膜が形 成される。これにより半導体ウエハ16上への薬液2b の塗布は完了する。

【0019】以上のように実施例1によれば、手動薬液供給器具33は容器30の近傍に配設されるので、薬液容器1dからノズル9 dまでの接続管10dの全長は短くなり、つなぎ込みに要する薬液の量が少なくなり、かつ、つなぎ込み時における接続管10dや手動薬液供給器具33内等の清掃処理等が容易であり、つなぎ込み作業が短時間に行え、また、ピストン35を手動でシリンダ34内を往復運動させるのみで評価用薬液2dが、所定の温度、湿度に制御された塗布カップ内で所定の回転数で回転する半導体ウエハの中心部へノズル移動手段によって移動されたノズル9dに供給され、上記半導体ウエハの中心部に滴下されて上記薬液の膜が形成されるため、自動で半導体ウエハ上に膜を形成したときと同等の膜厚均一性が得られ、かつ、多数の半導体ウエハへの薬液塗布処理が短時間に行える。

【0020】実施例2.上記実施例1では手動薬液供給器具33と薬液容器1 dとの間に逆止弁4 dを設けると共に手動薬液供給器具33とノズル9 dとの間に逆止弁5 dを設けたものを示したが、これに限らず、逆止弁4 d、5 dの代わりに電磁弁4 d、5 dを用い、薬液容器1 dから薬液の吸入時には電磁弁4 dを開き電磁弁5 d

を閉じ、また、上記吸入した薬液をノズル9 dへ供給時 には電磁弁4 dを閉じ電磁弁5 dを開くように制御する ようにしても良く、上記実施例1と同様の効果を奏す る。

【0021】実施例3.また、上記実施例1では手動薬 液供給手段としてシリンダ34とピストン35とからな る注射器形の手動薬液供給器具33を用いたものを示し たが、これに限らず、薬液容器から薬液を手動で吸引す ると共に吸引した薬液を吐出し得るものであれば良く、 例えばスポイドであっても良く、上記実施例1と同様の 10 布動作の説明図である。 効果を奏する.

[0022]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、半導 体ウエハが配設される塗布カップ内を所定の温度、湿度 に制御した状態で、かつ、上記半導体ウエハの中心部に 手動で薬液が滴下されるように構成したので、上記半導 体ウエハに自動で薬液を塗布する場合と同様な膜厚均一 性の塗布が行われ、少量の薬液で、かつ、その薬液に対 する信頼性の高い評価を容易に行うことができる等の効 果がある。

【0023】また、シリンダと、上記シリンダ内を往復 運動するピストンとで構成される手動薬液供給器具を第 1の弁を介し薬液容器に接続すると共にノズル移動機構 により半導体ウエハの中心部に移動されるノズルに第2 の弁を介して接続することにより、上記ピストンを往復 動作せることにより多数の半導体ウエハに連続して薬液 を塗布することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による薬液塗布装置を示す 構成図である.

R

【図2】従来の薬液塗布装置を示す構成図である。

【図3】図2に示されるノズル移動機構の詳細を示す構 成図である。

【図4】図3に示されるアームの動作を説明する説明図 である.

【図5】図2に示されるノズルの構成図である。

【図6】 従来の薬液塗布装置における手動による薬液塗

【符号の説明】

1a~1d 薬液容器

3a~3c ベローズポンプ

4a~4d 逆止弁

5a~5d 逆止弁

9a~9d ノズル

10a~10d 接続管

14 塗布カップ

15 チャック

20 17 駆動用モータ

18 ノズル移動機構

30 容器

31 塗布カップ外枠

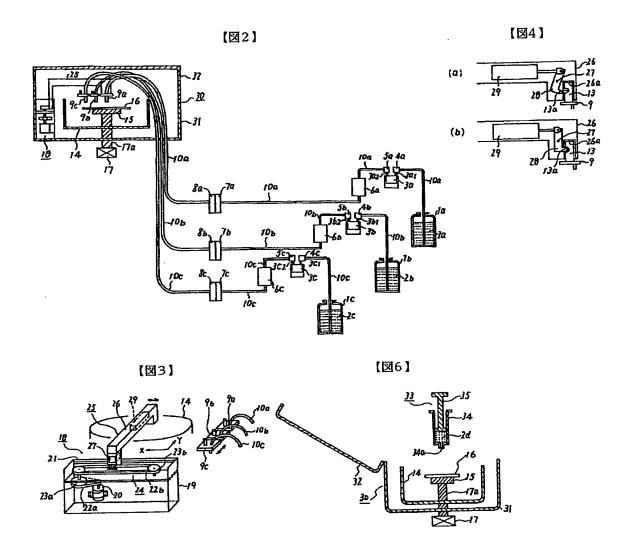
32 塗布カップカバー

33 手動薬液供給器具

34 シリンダ

35 ピストン

【図1】 【図5】 18:ノズル移動機構 31:独布カップ外种 33:手造運被供給發展 84:2329 35: ピストン



PAT-NO:

JP407283104A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07283104 A

CHEMICAL APPLICATION DEVICE

PUBN-DATE:

October 27, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAKAGAMI, TAKUYA

SAKAKI, EMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RYODEN SEMICONDUCTOR SYST ENG KK N/A

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

APPL-NO: JP06068415

APPL-DATE: April 6, 1994

INT-CL (IPC): H01L021/027 , B05C011/08 , G03F007/16

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable manual dropping of chemical like automatic application thereof by connecting a chemical manual supply means to a nozzle and a chemical container for dropping chemical to a semiconductor wafer and by moving the nozzle to a central part of a semiconductor wafer by a nozzle movement mechanism.

D. No.

CONSTITUTION: A nozzle 9d is arranged together with nozzles 9a, 9b, 9c. An injector type manual chemical supplier 33 is connected to a chemical container 1d wherein appreciation chemical 2d is put through a check valve 4d and is connected to the nozzle 3d through a check valve 5d. At first, the nozzle 9d is selected by a nozzle movement device 18 and is moved to a central part of a semiconductor wafer 16 inside an application cup 14 whose temperature and humidity are controlled as specified. Then, a piston 35 of the manual chemical supplier 33 is manually pulled in a direction as indicated with an arrow A and the appreciation chemical 2d is sucked into a cylinder 34. Then, the piston 35 is pushed in a direction as indicated with an arrow C, and the appreciation chemical 2d inside the cylinder 34 is supplied to the nozzle 9d and is dropped on a central part of the semiconductor wafer 16.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)